

回転式反射率測定システム GS-191-FA-1045(全自動タイプ)



GS-191-FA-1045は、全自動タイプの測定システムです。コーティングガラス、基板、拡散面の分光特性および色特性を第二面(二層目)のマスキングなしに0°および45°の入射角で同時に自動測定します。500μmまでの薄い基板を、通常1測定あたり200 msecの速度で測定することが可能です。

高精度分光放射測定システム、独自の測定技術、およびガンマサイエンティフィックによって開発された低照度測定技術の専門知識に基づいた本製品は、屈折率の決定と薄膜コーティングの厚さの両方を含む、業界をリードする精度、再現性、スループットを特長としています。

高精度・高再現性を保証する反射率測定装置

- 1測定あたり200msecという短いスキャンタイムで、非破壊的に完全な分光特性および色特性を評価可能
- 厚さ500μmまでのガラス基板の第一面を、第二面のマスキングなしに別々に測定可能
- 全反射率測定または内部光学インターフェースの特定
- 拡散面や鏡面に対するテスト機能
- プログラム可能なマルチロケーション測定、合否判定機能、ビニング機能

アプリケーション

- 反射防止膜の特性評価
- フラットパネルディスプレイのガラス試験
- タッチスクリーンディスプレイのガラス試験
- 光学フィルター・レンズ試験
- 熱分解ガラスコーティングのテストと特性評価
- フラットパネルディスプレイ、太陽電池用コーティング、低放射建築用コーティング、塗料サンプル、拡散性プラスチック

Gamma Scientificは、卓越した技術力と機能性に加え、NVLAP (NVLAP lab code 200823-0)を取得し、ISO/IEC 17025機関に認定されています。

GS-191-FA-1045 仕様

光学ヘッド		
ヘッド種類 0°、20°もオプションとして選択可能	191F-10	191F-45
測定タイプ	一層鏡面反射	一層鏡面反射
対応サンプル	ガラス	ガラス
光源入射角	10°	45°
観測角	10°	45°
サンプル最小厚み ※一層反射のみ	0.5mm	0.25mm
サンプル最大厚み	6mm	6mm
最大サンプルサイズ	要相談、最大3種類までサポート可能	
波長範囲	360-830nm	360-830nm
照射スポット径	1mm x 10μm	1mm x 10μm
測定スピード	<1500ms	<1500ms
校正参照標準	BK-7光学ガラス(内蔵)	BK-7光学ガラス(内蔵)
分光反射率	± 0.5%	± 0.5%
三刺激値(CIE 1931 X, Y, Z)	± 0.05	± 0.10
色度(CIE 1931 x, y)	± 0.005	± 0.005
Lab色空間(CIE 1976 L*, a*, b*)	L* ± 2.0 a*, b* ± 0.8	L* ± 2.0 a*, b* ± 0.8
平均反射	± 0.2	± 0.2

回転ステージ	
光学ヘッド	191F-1045
1サンプルあたりの測定位置	標準3ヶ所(最大5ヶ所)
ガラス基板	取り付け用3基、測定光学部品用5基
サイクルタイム	<1サンプルあたり6秒(取り付け・取り外し時間3秒含む)
分光データ	波長関数としての反射率
色データ	CIE三刺激X, Y, Z、2°または10°視野、(L*, a*, b*)、(x, y)、(u', v')、およびその他のパラメータ
寸法及び重量	高さ:1.75m 幅:1.6m 奥行:1.6m 重量:1000kg
環境条件	温度:0~35℃ 湿度:90%以下(非結露)

仕様は予告なく変更されることがあります。